

CaWO₄-Li₂WO₄ 陶瓷低温烧结特性及微波性能研究

章 著, 苏 桦, 唐晓莉, 张 磊, 江 超, 荆玉兰

(电子科技大学 电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 四川 成都 610054)

摘要:采用固相反应法制备了($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄($0 \leq x \leq 0.14$)微波陶瓷, 研究了Li₂WO₄作为第二相对CaWO₄微波陶瓷的低温烧结特性和微波性能的影响。结果表明, Li₂WO₄相的存在能明显降低CaWO₄的烧结温度, 并且随着x的增加, ($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄($0 \leq x \leq 0.14$)陶瓷体系的最佳烧结温度降低。当x=0.1, 在900 °C下烧结2 h, 该陶瓷材料的介电常数 $\epsilon_r=9.002$, 品质因数与频率之积 $Q \times f=11.76 \times 10^4$ GHz, 谐振频率温度系数 $\tau_f=-55 \times 10^{-6} / ^\circ C$ 。在此基础上采用w(CaTiO₃)=5.0%调节其谐振频率温度系数到0, 调节后的微波介电性能为 $\epsilon_r=10.312$, $Q \times f=5.36 \times 10^4$ GHz, $\tau_f \approx 0$

关键词:微波介电性能; 低温共烧陶瓷(LTCC); CaWO₄-Li₂WO₄陶瓷; 低损耗; 零谐振频率温度系数

中图分类号: TM28; TN604 文献标识码: A

Low-temperature Sintering and Microwave Dielectric Properties of CaWO₄-Li₂WO₄ Ceramics

ZHANG Zhu, SU Hua, TANG Xiaoli, ZHANG Lei, JIANG Chao, JING Yulan

(State Key Lab. of Electronic Thin Films and Integrated Devices, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China)

Abstract: The ($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄($0 \leq x \leq 0.14$) microwave ceramics were prepared by the solid state reaction method. The effect of Li₂WO₄ as second phase on the low-temperature sintering and microwave dielectric properties of CaWO₄ was investigated. The results showed that the existing Li₂WO₄ phase can reduce the sintering temperature of CaWO₄ significantly; furthermore, with x increase, the optimal sintering temperature of ($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄($0 \leq x \leq 0.14$) ceramic system decreased. At x=0.1, the ($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄ ceramics sintered at 900 °C for 2 h presented excellent microwave dielectric properties. The dielectric constant of ϵ_r is 9.002, the $Q \times f$ is 11.76×10^4 GHz and the temperature coefficient of resonant frequency of τ_f is $-55 \times 10^{-6} / ^\circ C$. On this basis, w(CaTiO₃) = 5.0% was used to adjust the temperature coefficient of resonant frequency to zero. The microwave dielectric properties after adjusting was $\epsilon_r=10.312$, $Q \times f=5.36 \times 10^4$ GHz and $\tau_f \approx 0$.

Key words: microwave dielectric properties; LTCC; CaWO₄-Li₂WO₄; low loss; $\tau_f \approx 0$

0 引言

目前通信产业发展快速, 对微波陶瓷材料提出的要求也在增加。对于应用于微波频段的陶瓷材料, 我们希望介电常数较小($\epsilon_r \leq 15$)以减小信号的延迟时间, 同时希望损耗足够小及谐振频率温度系数 $\tau_f \approx 0^{[1-2]}$ 。调查发现白钨矿结构的CaWO₄在1 100 °C的烧结温度下能烧结致密且具有较好的微波介电性能($\epsilon_r \approx 10$, 品质因数与频率之积 $Q \times f \approx 75 000$ GHz)^[3]。Li₂WO₄的微波介电性能较好($Q \times f \approx 62 000$ GHz)^[4]且熔点低(约741 °C)。本研究的目的是想通过调节CaWO₄和Li₂WO₄两相比例探讨($1-x$)CaWO₄- x Li₂WO₄系列陶瓷的低

温烧结特性和微波介电性能的变化规律及谐振频率温度系数特性。

1 实验

采用传统的陶瓷制备工艺, 以分析纯WO₃(99%), CaCO₃(99.9%), Li₂CO₃(99%), CaTiO₃(99%)为原料。原料分别按化学式Ca_{1-x}Li_{2x}WO₄($x=0, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14$)和0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄掺杂CaTiO₃(w(CaTiO₃)=3%, 4%, 5%, 6%, 7%)的化学计量比配料。经球磨、烘干后Ca_{1-x}Li_{2x}WO₄和CaTiO₃的预烧分别在800 °C和1 050 °C下预烧2 h。再经球磨、烘干、造粒、干压成型为Φ12 mm×6 mm的圆柱, 然后在

收稿日期:2013-06-03

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51072029, 61271038);四川省科技支撑计划基金资助项目(2013GZX0144)

作者简介:章著(1987-),男,四川内江人,硕士生,主要从事LTCC微波陶瓷及微波器件的研究。

850~950 °C下烧结保温2 h。烧结温度随 x 的变化而不同。

用X线衍射法(XRD; DX-2700型)分析烧结样品的相组成和结构。采用Hakki-Coleman法和Agilent N5230A(300 MHz~20 GHz)矢量网络分析仪测量陶瓷的微波介电性能及频率温度系数 τ_f 。 τ_f 测量温度范围为25~80 °C。

2 实验结果与讨论

图1为在900 °C、烧结2 h下,(1-x)CaWO₄-xLi₂WO₄(0≤x≤0.14)陶瓷和0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄掺杂w(CaTiO₃)=5%的XRD图谱。由图可看出,Li₂WO₄作为第二相存在于该复合陶瓷体系中,且随着 x 的增加,Li₂WO₄衍射峰越明显,无其他杂相生成。且CaTiO₃与0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄无反应,没有生成其他杂相。

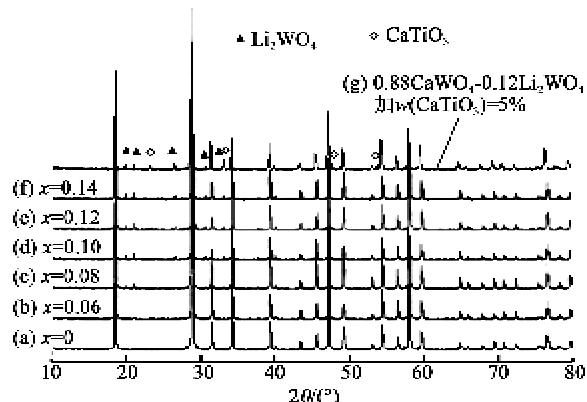


图1 (1-x)CaWO₄-xLi₂WO₄陶瓷样品在900 °C下烧结2 h的XRD图谱

图2为在900 °C、烧结2 h下,(1-x)CaWO₄-xLi₂WO₄(0.06≤x≤0.14)陶瓷的Q×f值随 x 和烧结温度变化的曲线。图3为0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄掺杂不同w(CaTiO₃)在900 °C下烧结2 h的Q×f值曲线。由图2可看出,随着 x 的增加,复合体系的最佳烧结温度降低,这主要是因为Li₂WO₄起到了液相助烧的作用,含量增加效果更明显。在烧结温度为900 °C和950 °C时,整个陶瓷体系的Q×f值先增加到最大值后逐渐减小,这主要是因为过多的液相可能引起主晶相晶粒的异常生长。(1-x)CaWO₄-xLi₂WO₄(0.06≤x≤0.14)陶瓷的Q×f值在 $x=0.1$,烧结温度为900 °C时Q×f取得最大值(11.76×10^4 GHz)。考虑到CaTiO₃的烧结温度较高,本实验选择最佳烧结温度更低的0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄配比来调节 τ_f 值。由图3可看出,在0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄复合体系中添加CaTiO₃后,随着CaTiO₃含量的增加,整体的

Q×f值逐渐减小,这主要是由于CaTiO₃的烧结温度高难以在低温烧结,并且其Q×f值较小。

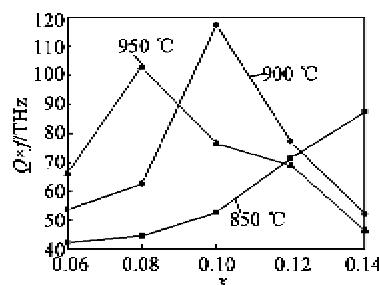


图2 (1-x)CaWO₄-xLi₂WO₄(0.06≤x≤0.14)陶瓷的Q×f值随 x 和烧结温度的变化曲线

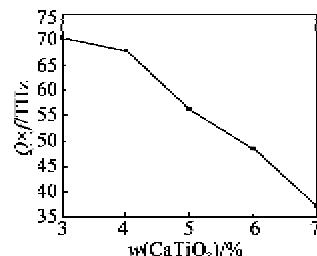


图3 0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄样品的Q×f值随w(CaTiO₃)的变化曲线

图4为在900 °C、烧结2 h下,0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄烧结样品的 ϵ_r 随w(CaTiO₃)变化的曲线。由图可看出,随着w(CaTiO₃)的增加,陶瓷整体的 ϵ_r 逐渐增大。混合体系的 ϵ_r 可按照对数混合法则计算得到^[5]:

$$\ln \epsilon_r = V_1 \ln \epsilon_{r1} + V_2 \ln \epsilon_{r2} \quad (1)$$

式中: V_1 、 V_2 分别为CaTiO₃和0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄的体积分数; ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} 分别为CaTiO₃和0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄的介电常数,即 $\epsilon_{r1}=162$, $\epsilon_{r2}=8.76$ 。由式(1)可知,实测值和理论值较吻合。

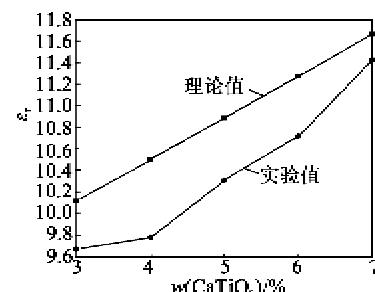


图4 0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄样品的 ϵ_r 随w(CaTiO₃)的变化曲线

图5为在900 °C、烧结2 h下,0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄掺杂CaTiO₃含量烧结样品的 τ_f 值随w(CaTiO₃)变化的曲线。由图可看出,随着CaTiO₃含量的增加,陶瓷整体的 τ_f 从负值逐渐增加到正

值。在复合陶瓷体系中,理论的 τ_f 值^[6]为

$$\tau_f = V_1 \tau_{f1} + V_2 \tau_{f2} \quad (2)$$

式中 τ_{f1} 、 τ_{f2} 分别为 CaTiO₃ 和 0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄ 的谐振频率温度系数。由于 CaTiO₃ 的 τ_f 值为正,因此测试曲线和理论较符合。其中在 $w(\text{CaTiO}_3)=5\%$ 时 $\tau_f=1.2 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。

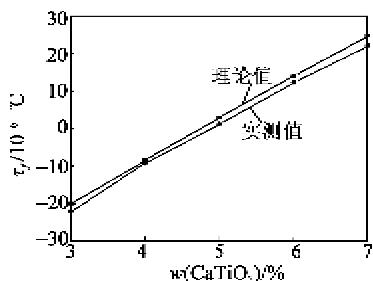


图 5 0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄ 样品的 τ_f 值随 $w(\text{CaTiO}_3)$ 的变化曲线

3 结束语

CaWO₄-Li₂WO₄ 陶瓷属于低介电常数陶瓷体系,采用传统的固相反应法能制备烧结温度符合 LTCC 要求且损耗很低的微波陶瓷。实验发现 Li₂WO₄ 第二相能降低 CaWO₄ 的烧结温度,且材料整体能保持很好的 $Q \times f$ 值。当 $x=0.1$, 在 900 ℃ 下烧结 2 h, 该陶瓷材料的 $\epsilon_r=9.002$, $Q \times f=11.76 \times 10^4$ GHz 及 $\tau_f=-55 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 。利用 CaTiO₃ 的正谐振频率温度系数可调节 CaWO₄-Li₂WO₄ 陶瓷的 τ_f 值使其趋于 0。0.88CaWO₄-0.12Li₂WO₄ 摹杂 $w(\text{CaTiO}_3)=5\%$ 在 900 ℃ 下烧

(上接第 262 页)

- [6] MANDALAPU L J, YANG Z, XIU F X, et al. Homojunction photodiodes based on Sb-doped p-type ZnO for ultraviolet detection [J]. Appl Phys Lett, 2006, 88: 092103.
- [7] WANG X, WANG X, ZHOU J, et al. Piezoelectric field effect transistor and nanoforce sensor based on a single ZnO nanowire [J]. Nano Lett, 2006, 6(12): 2768-2772.
- [8] LEE H J, JEONG S Y, CHO C R, et al. Study of diluted magnetic semiconductor: Co-doped ZnO [J]. Appl Phys Lett, 2002, 81(21): 4020-4022.
- [9] WAN Q, LI Q H, CHEN Y J, et al. Fabrication and ethanol sensing characteristics of ZnO nanowire gas sensors [J]. Appl Phys Lett, 2004, 84(18): 3654-3656.
- [10] CHEN X G, LI F, SANG J P. Microcosmic Analysis of UI Characteristic of ZnO Pressure-sensitive Ceramics [J]. High Voltage Engine, 2007, 4: 009.
- [11] NI M, CHENG Q, ZHANG W F. Energy and charge transfers between (Bu₄N)₂(Ru)(dcbpyH)₂(NCS)₂ (N719) and ZnO thin films [J]. J Appl Phys, 2010, 107 (5): 053702-053702-5.
- [12] MAHAN G D. Intrinsic defects in ZnO varistors [J]. J Appl Phys, 1983, 54(7): 3825-3832.
- [13] 姚允斌. 物理化学手册 [M]. 上海:上海科学技术出版社, 1985.
- [14] KIM Y, LEE W, JUNG D R, et al. Optical and electronic properties of post-annealed ZnO:Al thin films [J]. Appl Phys Lett, 2010, 96(17): 171902-171902-3.
- [15] TAN S T, CHEN B J, SUN X W, et al. Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition [J]. J Appl Phys, 2005, 98(1): 013505-013505-5.